

# Model AE-3245A 5 分类数字 C-tan $\delta$ 测量仪

最适合检查铝质电解电容质、老化工程

## 特 征

- 检测功能标准配备
- 测量频率: 120Hz[正弦波]
- 测量时间: 约 105msec.[包含接触 & 残留电压检测时间]
- 测量范围: C[0~39.99mF]/tan  $\delta$ [0~199.9%]
- 内置比较器功能 5 分类判定显示及输出
- Centronics 输出标准配备



# Model AE-3245A 5 分类数字 C-tanδ 测量仪

## SPECIFICATIONS

测量范围及基本精度 适用于 C:200(digit)~3999(digit)/tanδ <99.9% (环境温度 23°C±5°C)

量程	400nF	4μF	40μF	400μF	4mF	40mF
C 精确度	±0.5%±2(digit)				±2%±2(digit)	±2%±5(digit)
tanδ 精确度	± $\left[ \frac{\tan\delta(\text{digit}) \times 0.3}{100} + 2 + \frac{2000}{C \text{ 表示(digit)}} \right]$ digit					± $\left[ \frac{\tan\delta(\text{digit})}{100} + 5 + \frac{2000}{C \text{ 表示(digit)}} \right]$ digit
测量模式	串联等效电路					

※tanδ 为 100.0%~199.9% 的情况下, C 以及 tanδ 的精度则为上述的 2 倍。

测量模式	串联等效电路
测量讯号等级	约 400mV (r.m.s.) 以下
测量方式	由电压、电流、防护端子所构成的 5 端子
测量频率	120Hz±0.1%、正弦波
测定端子	前面板部: 接线柱 5 端子 后面板部: 8P 圆形金属电路连接器
接触检测	输入端子的 1 端子上接触电阻约为 200Ω 以上时, 为检测错误
残留电压检测	用 4 端子连接, 检测样品的未放电电压约为 2.2V 以上时, 保护检测电路 (输入保护)
测量时间	【HOLD 模式测量时间】约 105msec. 【接触检测 & 残余电压检测】约 27msec. 【测量稳定时间】约 45msec. 【到测量端子开放为止】约 96msec. 【空转模式测量时间】约 3 次/秒
判定结果显示	容量[C]: CLO、CLG、CGO、CHG、CHI tanδ: DGO、DNG
判定结果外部输出	GO1、GO2、CNG、DNG
控制讯号	输入: START、HOLD、RESET、CINH、SHIFT、NINH、GINH 输出: GO1、GO2、CNG、DNG、CER、COV、DER、DOV、CEND、MEND、BUSY、SLCT、CCE、VCE、各种切换判定
数据接口	Centronics 输出
周围使用环境	温度: 0°C~+40°C、湿度: 80%以下 (不结霜情况下)
所需电源	AC85V~265V、50~60Hz、约 45VA
外形尺寸	432(W)×149(H)×450(D)mm (不含底部橡胶等突起部分突起部分。)
重量	约 10kg

○说明书的内容会因机台改良而随时变更,恕不另行通知。

## AEMIC 株式会社

〒612-8448

京都市伏見区竹田東小屋ノ内町 34 番地

电话:+81-75-612-0710 FAX:+81-75-612-0750

E-Mail: sales@ae-mic.com

http://www.ae-mic.com